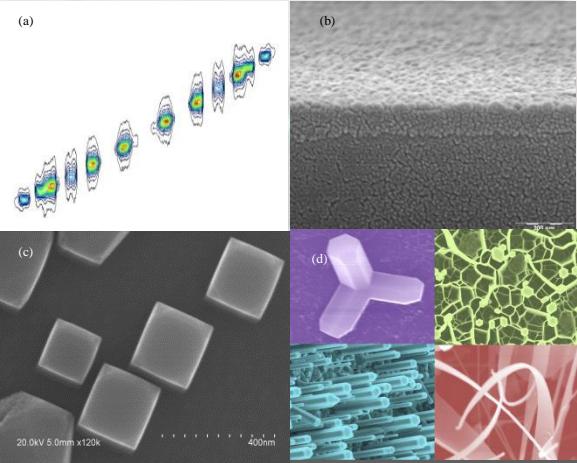




Jornada científica sobre Técnicas de caracterización de superficies.

Valencia, 31 de Octubre de 2012

Fundación Universidad-Empresa, ADEIT, Plaza Virgen de la Paz 3, Valencia

PATROCINADOR	PRESENTACIÓN	PROGRAMA
<p>Generalitat Valenciana</p>  <p>Conselleria d'Educació</p> <p><u>Coordinación</u> Vicente Muñoz Sanjosé</p> <p><u>Comité organizador</u> M. Carmen Martínez Tomás Laura Olivares</p>  <p>(a) Mapa de un barrido Renninger (b) Capa de ZnO delgada. (c) Cristales CdO (MOCVD) (d) Nanoestructuras de ZnO</p>  <p>VNIVERSITAT ID VALÈNCIA</p>	<p>El grupo de crecimiento cristalino y caracterización de semiconductores (CreCYCSem) está constituido por investigadores del departamento de Física Aplicada y Electromagnetismo de la Universidad de Valencia, del Instituto Jaume Almera (CSIC) de Barcelona y del departamento de Física Aplicada II y Electricidad y Electrónica de la Universidad del País Vasco.</p> <p>La actividad investigadora del grupo se centra en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crecimiento cristalino de materiales avanzados, tanto en volumen, como en forma de capas y nanoestructuras, mediante diferentes técnicas (MOCVD, SP, PVT, THM, Bridgman...) - Caracterización morfológica y estructural (SEM, HRTEM, HRXRD...) - Caracterización de propiedades físicas, en particular de propiedades ópticas y defectos. <p>OBJETIVOS de la Jornada</p> <p>Estudio y discusión sobre técnicas de caracterización de superficies y su extensión a otras dimensionalidades.</p>	<p>Mañana</p> <p>9:30 Saludo de bienvenida. Vicente Muñoz Sanjosé</p> <p><i>Inicio de la Jornada Académica.</i> <i>Moderador Carmen Martínez.</i></p> <p>9:45 Conferencia de D. Alejandro González González. Slope selection-driven Ostwald ripening in ZnO thin film growth.</p> <p>10:30 Conferencia del Dr. SreeKumar Rajappan. ZnO nanoparticles grown on different substrates</p> <p>11:00 Pausa y café</p> <p><i>Moderador Càndid Reig</i></p> <p>11:30 Conferencia del Dr. Enrique Vasco. Estudio de tensiones en láminas de Au.</p> <p>12.15 Conferencia de la Dra. Celia Polop. Técnicas de caracterización de capas en el ICMM de Madrid.</p> <p>13.00 Conferencia de la Dra. Carmen Martínez Tomás. La difracción múltiple: una metodología para la caracterización de sustratos y capas.</p> <p>13:45 Comida</p> <p>15:30 Mesa redonda sobre aspectos colaborativos y líneas de desarrollo.</p> <p>16:30 Clausura y despedida</p>